

60th GREEN & 108th AMCP ジョイントオープンセミナー 「集束イオンビーム（FIB）を活用した3次元構造解析の最前線」

現在多くの分野で注目されている3次元構造解析技術について、FIBを活用した事例を紹介します。今回は日本FEI社の方にもご参加いただき、最新鋭のFIB-SEM複合装置に加え、従来のX線CTと3次元SEM法のギャップ領域を埋める手法として有望な、新しいFIB（XeプラズマFIB）による電池材料・電子デバイスに対する大領域解析についても紹介いただきます。また、磁性・スピントロニクス研究拠点の佐々木主任研究員より、アトムプローブ等を用いた最新の研究成果についてもご紹介いただきます。皆様、奮ってご参加ください。

開催日時：2017年7月27日（木） 13:00～17:15

開催場所：千現地区 先進構造材料研究棟 5F Conference Room

◆プログラム

①13:00～13:40

イントロダクション／セミナーの趣旨説明」（NIMS GREEN ナノ結晶解析G 杉山直之）

②13:40～14:40

最新鋭FIB-SEMによる3次元構造解析およびTEM試料作製の最新技術
（日本FEI 村田薫氏）

休憩 14:40～15:00

③15:00～16:00

プラズマFIBによる大領域3次元解析（日本FEI 村田薫氏）

④16:00～17:00

「金属材料のマルチスケール組織解析と新材料開発」

（NIMS 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 ナノ組織解析G 佐々木泰祐）

⑤17:00～ フリーディスカッション

